

ICS 31.120
L 47



中华人民共和国国家标准

GB/T 18680—2002

液晶显示器用氧化铟锡透明导电玻璃

The transparent conductive glass with indium-tin oxide films
used in liquid crystal display

2002-03-10 发布

2002-08-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

目 次

| | |
|--------------------------------|---|
| 前言 | Ⅲ |
| 1 范围 | 1 |
| 2 规范性引用文件 | 1 |
| 3 术语和定义 | 1 |
| 4 玻璃基片规格 | 1 |
| 5 SiO ₂ 阻挡层规格 | 4 |
| 6 ITO 导电膜层规格 | 5 |
| 7 膜层缺陷 | 5 |
| 8 抽样 | 6 |
| 9 检验和试验方法 | 6 |
| 10 标志 | 8 |
| 11 包装、运输、贮存 | 8 |

前 言

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：广州有色金属研究院。

本标准参加起草单位：深圳莱宝真空技术有限公司、深圳南玻集团股份有限公司。

本标准主要起草人：袁镇海、戴达煌、赵小伟、王志洁、付志强、黄绍江、侯惠君、林松盛。

液晶显示器用氧化铟锡透明导电玻璃

1 范围

本标准规定了液晶显示器(LCD)用氧化铟锡(Indium-Tin Oxide, ITO)透明导电玻璃的技术要求、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于液晶显示器用氧化铟锡透明导电玻璃。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB/T 5270 金属基体上的金属覆盖层(电沉积层和化学沉积层)附着强度试验方法
(eqv ISO 2819)

GB/T 14264 半导体材料术语

3 术语和定义

GB/T 14264 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

微观波纹度 Microcorrugation

在玻璃基片的浮法锡面(或抛光面)上,沿垂直于浮法拉伸方向扫描表面轮廓线,并设定截止波长为 0.8 mm~8.0 mm,选取任意 20 mm 取样长度,按图 1 所示的方法,得 PV 的间距 R_1 即为微观波纹度值。

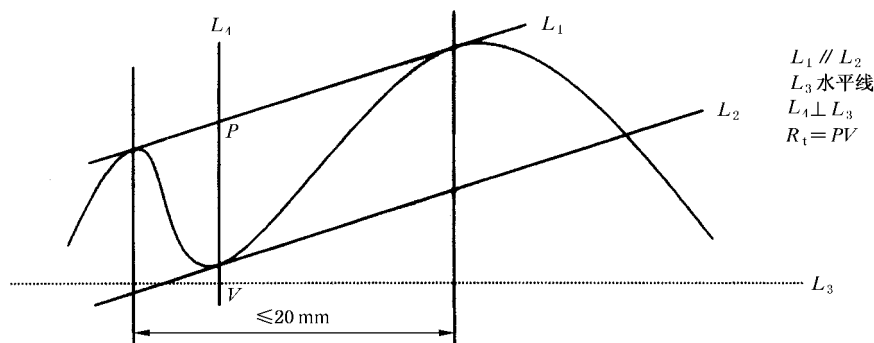


图 1 玻璃基片的微观波纹度

4 玻璃基片规格

4.1 长度及宽度的允许偏差

对于长度及宽度的公称尺寸在 470 mm 以内的玻璃基片,允许偏差均应为 ± 0.3 mm。

4.2 厚度的允许偏差

厚度的允许偏差应符合表 1 要求。